

晶体硅-位错密度测试-其他检测检测报告-百检网

产品名称	晶体硅-位错密度测试-其他检测检测报告-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中III、V族杂质含量的测试方法 GB/T 24581-2009 III-V族杂质含量

2 单晶硅 - 级杂质的低温FT - IR分析测试方法 SEMI MF1630-1107 III-V族杂质含量

3 硅片参考面结晶学取向 X射线测试方法 GB/T 13388-2009 主参考面晶向

4 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法 GB/T5252-2006 位错密度

5 锗单晶和锗单晶片 GB/T 5238-2019 4.6 单晶方片边长

6 锗单晶和锗单晶片 GB/T 5238-2019 4.6 厚度及总厚度变化

7 硅单晶抛光片 GB/T 12964-2018 5.5 参考面位置

8 硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法 GB/T 13387-2009 参考面长度

9 酸浸取 电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质 GB/T 24582-2009 基体金属杂质含量

10 高分辨率辉光放电质谱法测量太阳能电池硅材料中痕量元素的方法 SEMI V1-0709 基体金属杂质含量

11 硅多晶真空区熔基硼检验方法 GB/T 4060-2018 基硼电阻率

12 硅多晶气氛区熔基磷检验方法 GB/T 4059-2018 基磷电阻率

13 硅外延层晶体完整性检验方法 腐蚀法 GB/T 14142-2017 外延层位错

14 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法 GB/T 14847-2010 外延层厚度

15 硅外延层晶体完整性检验方法 腐蚀法 GB/T 14142-2017 外延层堆垛层错密度